顕微メスバウア分光装置を用いた多結晶シリコン中の鉄不純物観察

Observation of iron impurities in multi crystal silicon by Mossbauer Spectroscopy Microscope 静岡理工科大学 ^O渡辺 富夫, 伊野 裕司, 吉田 豊 Shizuoka Institute of Science and Technology ^oT. Watanabe, Y. Ino, Y. Yoshida

E-mail: yoshida@ms.sist.ac.jp

【はじめに】多結晶シリコン太陽電池に混入する鉄不純物は、キャリア の再結合中心となることで発電効率を低下させることが知られている. 我々は以前に、顕微メスバウア分光によって多結晶シリコン中の鉄不純 物は結晶粒界のみならず粒内にも分布し、結晶粒ごとに異なる分布が観 察できることを報告した[1]. 今回は、鉄故意汚染から拡散熱処理に至る プロセスを真空中で行い、200℃と 800℃でそれぞれ熱処理した試料中の 鉄分布と格子欠陥分布との対応を評価するため、顕微メスバウア分光と PL マッピングを同一視野で行ったので報告する.

【実験】30×30mm²の p型 (10¹⁶ B /cm³) 多結晶シリコン 2 枚に対して, ラマンマッピングと PL マッピングを行い結晶粒と欠陥の分布を調べた. Fe を 2nm 蒸着し, 200℃と 800℃でそれぞれ 60 分の熱処理を行った後, メスバウアスペクトル測定と Fe_i⁺成分に共鳴条件を合わせてメスバウ アマッピングを行った.

【結果】ラマンマッピング像を図1に、これと同一視野のPLマッピン グを図2に示す.図1で方位の異なる結晶粒の分布を観察し、図2で PL強度の分布を観察した.図1で赤、緑、青で色付けされた結晶粒が 確認でき、赤く色づけされた結晶粒は図2でPL強度の低下が見られた. また、ラマンマッピングとPLマッピングの対応から結晶粒界と転位の 分布を観察した.図3は200℃で1時間の熱処理後にFei⁺成分に共鳴条 件を合わせて得られたメスバウアマッピング像であり、図2で観察した 粒界と転位の分布を点線で示す.200℃×60minの熱処理による平均の 拡散長はおよそ 5µm で、転位などの近傍の歪み分布の影響がなければ 均一に分布しているはずである.しかしながら、マッピング結果は Fei²⁺が偏在しており、PL強度の低い結晶粒内でより偏在が顕著である ことを示唆している.更に、拡散の進んだ 800℃×1 時間の熱処理を行 った試料で結晶欠陥と Fei²⁺分布の対応について検討した.



200µm 図 1 ラマンマッピング像



200µm 図 2 PL マッピング像



250µm 図 3 熱処理 200℃×1 時間後の Fe²⁺成分のメスバウアマッピング

【謝辞】本研究は JST 「先端計測分析技術・機器開発事業」の援助を

受けて実施した.多結晶試料を提供していただいた名古屋大学大学院工学研究科の宇佐美徳隆教授,高橋勲 助教に感謝いたします.

[1] K. Tanaka et al., Hyperfine Interact, 206, 75-78 (2012).